●CCDカメラによる非接触計測技術の物性測定への応用

東ソー分析センター 四日市事業部 解析グループ 志村 尚俊 松本 良憲 山本 武志

1. はじめに

材料物性を評価するには、外場を与え、その応答を 観測する方法が一般的である。例えば、外場として変 形を与えたときの応答として力の計測、外場として温 度変化を与えたときの応答としての変形の計測などで ある。引張試験で代表される力学物性評価では、これ まで、応答は試験片に"接触"して計測することが一 般的であった。しかしながら、試料によっては接触す ることによって試験結果に影響を与えることがある。 例えば、JIS規格に準じて引張弾性率評価を行う場合、 Fig.1に示したように引張ひずみは接触法によるひず み計で計測する。ゴムのような柔らかい材料にひずみ 計を装着すると、ひずみ計自身の重みで試料が変形す ることがある。そのような場合、引張による変形量と ひずみ計を装着することによる変形量を分離すること は実際上不可能であるため、得られた弾性率は見かけ 上の値となる。

同様にフィルム状試料の弾性率も接触式では評価が 困難である。このような背景から一部の装置メーカー はビデオやCCDカメラを用いたひずみ計をオプショ ンとして提供している。

近年では、各種電子技術が容易に利用できるように なった。CCDカメラもその一つで、比較的安価な市 販品を入手することができる。本報告では、市販 CCDカメラを利用してひずみを計測した事例を紹介 する。



Fig.1 従来法による引張試験

CCDカメラを用いたひずみの評価には画像照合法¹⁾ など高度な処理を必要とする方法もあるが、ここでは単純に試料表面にマーカーを描いて撮影する方法を用いた。

本技術紹介では、測定原理について触れた後、引張 試験におけるひずみ測定やポアッソン比測定、線膨張 係数測定を行った結果を中心に紹介する。

2. 測定原理

測定原理をFig. 2 に示す。基準となる形状を試料上 にマーカーとして記し、それをCCDカメラで撮影す る。撮影されたマーカーの変形量からひずみを評価す る。ここでのポイントは、CCDカメラでひずみだけ を評価しても、必ずしも物性を評価できないという点 である。例えば、弾性率を求めるには応力とひずみを 同時に測定することが必要である。今回、構築したシ ステムでは、ひずみと力、温度、湿度、電気抵抗など を時間の関数として同期させて取り込み、コンピュー ター処理することによって、弾性率や線膨張などの物 性を評価できるようにした。

3. 引張試験への適用

引張試験ではひずみと力を計測する。ひずみの計測 には、Fig.1に示すひずみ計やひずみゲージが用いら



Fig. 2 構築した計測システム

れている。まず最初に、接触法と非接触法の整合性に ついて検討した事例を紹介する。接触法としては、ひ ずみゲージによる評価を行った。Fig.1の右に示すひ ずみゲージはポリイミド基板上に抵抗回路がプリント されたもので、試料に接着剤で貼り付けて使用する。 試料の変形に伴って基板が変形すると、回路の抵抗値 が変化し、変形量を検出する。金属等の変形検出に利 用されるように精度が高い半面、基板がポリイミドで あるため、柔らかい材料に使用すると、補強効果(試 料が見かけ上、硬くなる効果)のため、正確な値が得 られない。また、ポリエチレンなど難接着性の材料で は、試料の変形とひずみゲージの変形が一致しないた め、適用が困難だと考えられる。

ここでは、ポリカーボネート (PC)、高密度ポリエ チレン (HDPE) に対する測定例を示す。PCは接触 法でも十分に評価が可能だと予想される試料、HDPE は柔らかく、かつ適切な接着剤がないため、ひずみゲ ージの適用が困難な試料だと予想される。

Fig. 3に引張測定中に試料に加わった引張方向の縦 ひずみ (ε_L)、および垂直方向の横ひずみ (ε_T)を 試験時間に対してプロットした結果を示した。

PCの結果から、ひずみゲージ(接触法)と非接触 法から評価したひずみが一致しており、非接触法で従 来法と同等の評価が可能であることがわかる。さらに、 通常ひずみゲージではひずみ量2%程度までしか評価 できないのに対し、非接触法では一般的な硬質系プラ スチックが降伏する10%以上まで評価が可能であっ た。

一方、HDPEではひずみゲージと非接触法の評価結 果が異なった。PCの検討で非接触法が従来法と同等 であったことから、ひずみゲージでの評価結果に問題 があると考えられる。HDPEはPCに比べて柔らかい ために硬いひずみゲージを貼り付けることによる補強 効果が生じたこと、あるいは、ひずみゲージの接着が 十分でなく、試料の変形にひずみゲージの変形が追随 していなかったことが原因と考えられる。

このようにひずみゲージでは測定に問題があるよう な材料でも非接触法では測定が可能であった。

次に、試料厚みが約100 µmのフィルム状試料の引 張試験の結果をFig.4に示した。試料が薄いため、ひ ずみ計装着による影響が大きく従来法による測定は困 難であるが、非接触法を用いると、容易に評価が可能 である。力と縦ひずみの関係から弾性率、縦ひずみと 横ひずみの比 $(-\epsilon_{\tau} / \epsilon_{I})$ からポアッソン比を評価 することができた。ここで、ポアッソン比とは引張方 向の縦ひずみ(e₁)と引張方向と垂直方向の横ひず み(ε_τ)の比で、ゴム状試料で約0.5、硬質プラスチ ックで約0.3程度の値となる。ポアッソン比(-ε_τ/ ε₁)は、有限要素法によるコンピュータシミュレー ションにおいて構造体のひずみと応力の関係を計算す る際に必須となる値である。通常はJIS試験片等を用 い、ひずみゲージで評価する。Fig.5に示したように $縦ひずみ(\epsilon_{\tau}) と横ひずみ(\epsilon_{\tau}) は測定範囲で比例$ 関係にあって、一定のポアッソン比を得ることが出来 た。

弾性率とポアッソン比を繰返し回数N=5で試験し

項目	ポアッソン比	弾性率
単位	—	GPa
1	0.38	2.27
2	0.39	2.27
3	0.40	2.23
4	0.38	2.31
5	0.39	2.21
平均	0.39	2.26
標準偏差	0.01	0.04

Table.1 フィルムの引張り試験



Fig.3 接触法と非接触法の比較



Fig.4 フィルムの引張試験



Fig.5 ポアッソン比の解析

た結果を表1に示した。良い再現性が得られた。

引張試験における非接触法の利点は、適用試料の範 囲が広いということに加え、高温または低温測定でも 適用可能である点である。ひずみゲージなどの接触法 ではセンサーを試料に装着するため、測定環境と同じ 温度で作動するひずみ計を用意する必要があるが、非 接触法は観察窓の外から評価するため測定環境の影響 を受けない利点がある。検討の結果、恒温槽(-60~ 200℃)を用いた評価が可能であった。

非接触測定には、もう一つの利点としてカメラを複 数台組み合わせて観察できる点がある。接触法ではセ ンサーを装着できる場所がある程度限定される。例え ば、JIS規格の引張試験片の面方向(幅10mm)に装着 することはできても、厚み方向(厚み4mm)にひず みゲージを装着することは困難である。非接触法であ れば、カメラの倍率を調整することによって厚み方向 のひずみも同時に評価できる。ここには示さないが、 等方性材料、異方性材料について検討したところ、異 方性材料では幅方向と厚み方向でポアッソン比が異な るという結果を得た。

4. 線膨張率測定への適用事例

液晶モニターに代表される電子機器は多数のプラス チック材料と金属系材料を複雑に組み合わせて精密に 構成される。精密であるがゆえ、使用環境の変化に伴 う熱ひずみが問題となる場合がある。すなわち、金属 の線膨張率(1~10ppm/K)とプラスチックの線膨張 率(10~100ppm/K)の違いにより、熱環境の変化に 伴って構成材料間の寸法のバランスが狂い、各々の材 料にひずみが生じ、製品にゆがみを生じるおそれがあ る。

熱による変形量の材料間の違いを最小限に抑えるた めには、構成材料の線膨張率を合わせこむ必要がある。 しかし、プラスチックの線膨張率は材料そのものが持 つ特性に加え、加工履歴が大きく影響する²⁾。そのた め実際に用いられる部品形状で線膨張率を評価するこ とが望ましいが、電子機器等に用いられるプラスチッ ク部材は薄膜かつ微小であるため従来から用いられて いるTMA法では評価することが困難であった。

Fig.6に従来法であるTMA法の模式図を示す。 TMA法は試料にプローブを密着させ、プローブの位 置変化から試料長さの変化を評価する。測定方法には、 引張または圧縮の2つのモードがあるが、いずれの方 法も試料とプローブの密着性を確保するために試料に 微小な力を加える必要がある。

硬質材料の場合はTMA法でも問題ないが、ゴムな



Fig.6 TMA法の模式図

どの柔らかい材料や薄膜などは微小な力が評価結果に 影響を与える恐れがある。この例としてFig.7にポリ エーテルサルフォン (PES)の0.1mm厚フィルムを、 TMA法と非接触法で評価した結果を合わせて示した。 TMA法によると室温領域では温度に応じて長さが線 形に増加するが、PESのガラス転移温度近辺になると 試料が軟化し始めるために大きく変形し、室温に冷却 しても元の大きさには戻らない。これは試料に加えた 微小な力によって永久変形 (クリープ変形)してしま ったためである。一方、非接触法では昇降温させても ほぼ元の大きさに戻っており、クリープ変形は認めら れない。

非接触法の利点として、任意の面内二方向の線膨張 率を同時に評価できるという点もある。同時評価の例 としてポリエチレンテレフタレート(PET)の0.1mm フィルムに適用した事例をFig.8に示した。PETフィ ルムは透明性と耐熱性を両立させるため、加工段階に おいて特定の温度で2軸延伸しながら結晶化を進行さ せる。昇温時の挙動をMD、TD両方向で比較すると、 温度領域ごとに異なる挙動を示す。これはMD方向の



Fig.7 PESフィルムの線膨張



Fig.8 PETフィルムの線膨張

延伸とTD方向の延伸を異なる温度条件で実施してい ることと対応していると考えられる。

このように熱を与えたときの試料形状の変化をクリ ープなどの影響を受けずに計測できることから、他に も試料中の残留ひずみの評価などに適用することが可 能である。

5. その他の適用例

ここまでは、力や温度変化に伴う形状変化について 紹介した。非接触法の適用できる範囲は、これらの例 以外にも見出すことが出来る。例えば、外場を湿度変 化にすれば、湿度環境の変化にともなう変形を評価す ることができる。日常の生活環境では湿度の変化も大 きく、湿度による影響を調べることは重要である。

吸湿性のある厚み0.1mmの透明フィルムを用いた測 定例をFig.9に示した。湿度変化に対応して、試料の 大きさが変化している。試料周辺の湿度は1分程度で 設定値に追随していた。一方、湿度変化に対して試料 形状は少し遅れを伴い変化した。湿度を上げる過程で は、湿度変化に対する形状変化は良い追随性をみせた が、湿度を下げる過程での形状変化は湿度に対する追 随性が悪く、複雑な挙動を示した。

また、顕微鏡と組み合わせると観察対象を小さくす ることも可能である。Fig.10、11にホッチキスの針の 太さ(約1mm)の温度変化と毛髪の太さ(約0.1mm) の温度変化を示した。試料が小さいため、与える外場 は限定されるが、応答としてひずみを評価することは 容易である。ホッチキスの針が温度に伴って太くなり、 一方、毛髪は温度を上げると乾燥し細くなる事がわか る。

外場として電場、磁場などを活用すれば非接触法の 適用範囲はまだまだ広がると考えられる。



Fig.9 透明フィルムの耐湿試験



Fig.10 昇温に伴うホッチキス針の変化



Fig.11 昇温に伴う毛髪径の変化

6. おわりに

非接触法を用いてひずみを評価した事例を紹介し た。接触法に比べ非接触法の適用範囲は広く、これま で評価が困難だった柔軟材料や薄膜の評価が可能にな る。ここで紹介した評価方法以外にも、様々な評価法 が可能であると考えられる。今後も検討を継続し、適 用範囲を広げていきたい。

References

- 1) 例えば、K.Murata, et.al., *Mokuzai Gakkaishi*, 5(45), 375 (1999)
- 2)例えば、瀬戸雅宏他:成形加工、13 (12)、812 (2001)